

M., 1985; Van Hove M. A., Tong S. Y., Surface scattering by LEED, B., 1979.

М. И. Рязанов.

ДИФРАКЦИЯ НЕЙТРОНОВ — явление рассеяния нейтронов, в к-ром определяющую роль играют волновые свойства нейтрона (см. Корпускулярно-волновой дуализм). Длина волны λ и импульс p связаны соотношением де Броиля $\lambda = hp$. Матем. описание Д. н., так же как

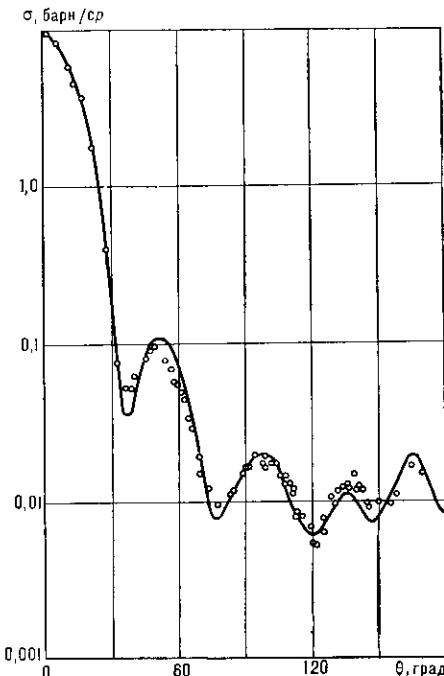
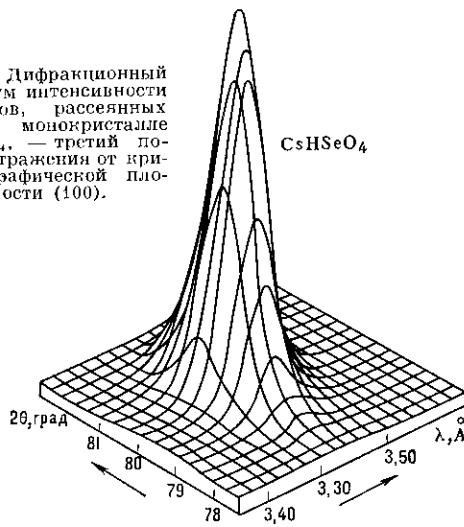


Рис. 1. Угловое распределение нейтронов с энергией 14 МэВ, рассеянных на ядре Sn; σ — сечение рассеяния; θ — угол рассеяния.

и в случае др. волновых полей, следует из принципа Гюйгенса — Френеля и, в этом смысле, аналогично описанию дифракции света, рентг. лучей, электронов и др. микрочастиц (см. Дифракция волн). Согласно этому

Рис. 2. Дифракционный максимум интенсивности нейтронов, рассеянных на монокристалле CsHSeO₄, — третий порядок отражения от кристаллографической плоскости (100).



описанию, интенсивность рассеянного излучения в некоторой точке пространства зависит как от λ , так и от свойств рассеивающего объекта. Соответственно, Д. н. применяется как для исследования или формирования нейтронных пучков (нейтронные монохроматоры, ана-

лизаторы), так и для исследований строения рассеивающего вещества.

В области энергий нейтрона $E \sim 10^{-7}$ эВ ($\lambda \sim 10^{-12}$ см) Д. н. проявляется при рассеянии нейтронов на атомных ядрах (рис. 1). При $E \sim 10^{-2}$ эВ ($\lambda \sim 10^{-8}$ см) Д. н. применяется для исследования атомной и магнитной структуры конденсиров. сред (кристаллы,

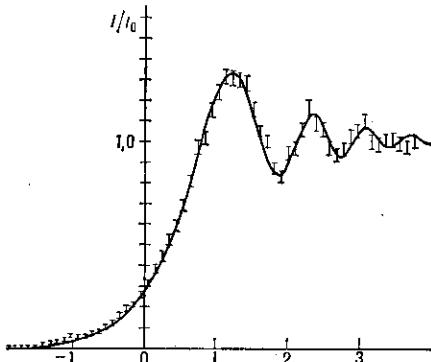


Рис. 3. Интенсивность пучка нейтронов после прохождения мимо поглощающего экрана с резким краем ($\lambda=20$ Å). Одна единица по горизонтальной оси соответствует смещению приёмной щели (шириной 30 мкм) на расстояние 100 мкм.

жидкости, макромолекулы). Для нейтронов с $\lambda \sim 10^{-8}$ см кристалл представляет собой трёхмерную дифракц. решётку и Д. н. проявляется в виде максимумов интенсивности с резкой зависимостью от λ и угла рассеяния θ (рис. 2). При $\lambda \geq 10^{-7}$ см Д. н. реализована на краю непрозрачного экрана (рис. 3), щелях и др. классич. объектах дифракции с целью эксперим. проверки некрых положений квантовой механики.

Наиб. широко Д. н. применяется в нейтронографии. Отличия по сравнению с дифракцией рентгеновских лучей или с дифракцией электронов в том, что нейтроны в оси, взаимодействуют с атомными ядрами и магн. моментами электронных оболочек атомов. Сферич. волна, рассеянная от ядром [$b/r \exp(ikr)$; r — радиус-вектор точки, k — волновой вектор], характеризуется амплитудой рассеяния b , не зависящей для медленных нейтронов от (длины т. н. вектора рассеяния $\mathbf{x} = k_0 - k$, $(k = k_0 = 2 \pi/\lambda)$, что связано с малостью размеров ядра ($\sim 10^{-12}$ см) по сравнению с λ ($\sim 10^{-8}$ см)).

Когерентные длины рассеяния медленных нейтронов некоторыми элементами и изотопами ($\times 10^{-12}$ см)

Элемент, изотоп	$b_{\text{ког}}$	Элемент, изотоп	$b_{\text{ког}}$	Элемент, изотоп	$b_{\text{ког}}$
H	-0,3741	Sc	1,23	Nb	0,7054
² H	-0,3742	Ti	-0,330	Mo	0,695
² P	0,6674	V	-0,0382	Gd	0,51
³ Li	-0,140	Cr	0,3635		-0,16i
⁴ Li	0,20	⁵⁰ Cr	-0,450	In	0,406
	-0,026i	⁵² Cr	0,492		-0,54i
⁷ Li	-0,222	⁵³ Cr	-0,420	Sn	0,6228
Be	0,779	⁵⁴ Cr	0,455	Te	0,543
B	0,530 + + 0,021i	Mn	-0,373	I	0,528
¹⁰ B	0,01	Fe	0,954	Cs	0,542
	-0,107i	Co	0,250	La	0,824
¹¹ B	0,865	Ni	1,03	Ce	0,484
C	0,6648	⁵⁸ Ni	1,44	Pr	0,445
N	0,936	⁶⁰ Ni	0,28	Nd	0,769
O	0,5805	⁶¹ Ni	0,760	Ta	0,691
F	0,565	⁶² Ni	-0,87	W	0,477
Na	0,363	⁶³ Ni	-0,038	Re	0,92
Mg	0,5375	Cu	0,7718	Os	1,10
Al	0,3449	Zn	0,5680	Ir	1,06
Si	0,4149	Gc	0,8193	Pt	0,963
P	0,513	As	0,658	Au	0,763
S	0,2847	Se	0,7970	Hg	1,266
Cl	0,9579	Br	0,679	Tl	0,879
K	0,371	Kr	0,780	Pb	0,940
Ca	0,490	Rb	0,708	Bi	0,8526
		Zr	0,716	U	0,8417